

Kurzbeschreibung

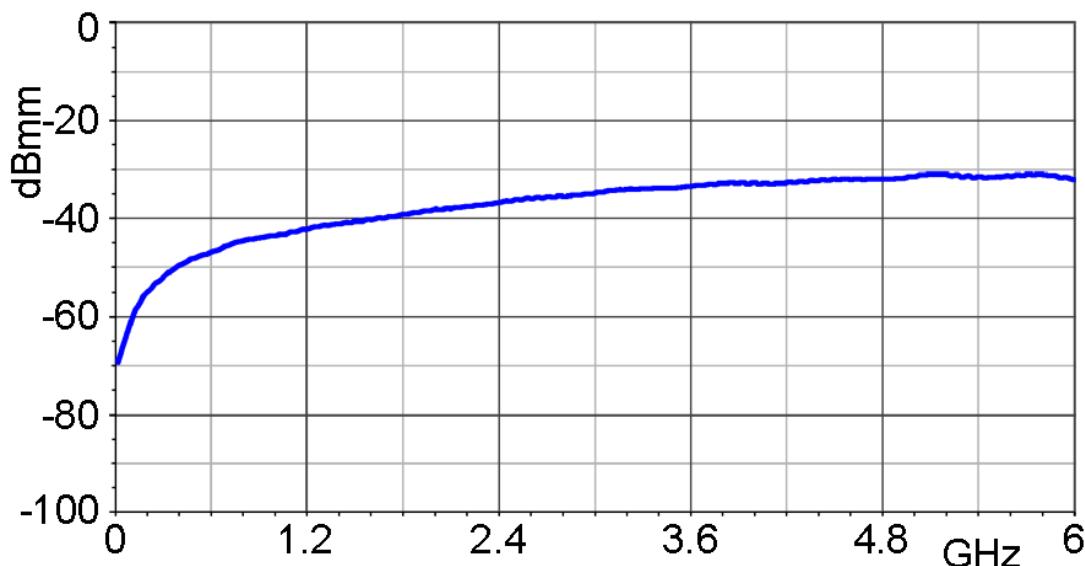
Die Nahfeldsonde erfasst die elektrischen Felder, die aus Messobjekten (ICs) auskoppeln. Die Flanken des Sondenkopfes sind geschirmt, so dass seitlich eintreffendes E-Feld nicht gemessen wird. Die Empfindlichkeit der Nahfeldsonde ermöglicht Messungen im Abstand von 0,5 mm bis 10 mm über IC's und Baugruppen.

Die XF-E 04s ist eine passive Nahfeldsonde. Sie besitzt den gleichen prinzipiellen Aufbau wie die Sonde XF-E 09s. Zur Messung wird die E-Feldsonde über die Bauelemente oder Bereiche der Flachbaugruppe geführt bzw. aufgesetzt. Die Oberseite und die Flanken des Sondenkopfes sind elektrisch geschirmt. Die E-Feldsonde hat eine Mantelstromdämpfung. Die Nahfeldsonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50Ω Eingang angeschlossen. Die E-Feldsonde besitzt intern einen Abschlusswiderstand.

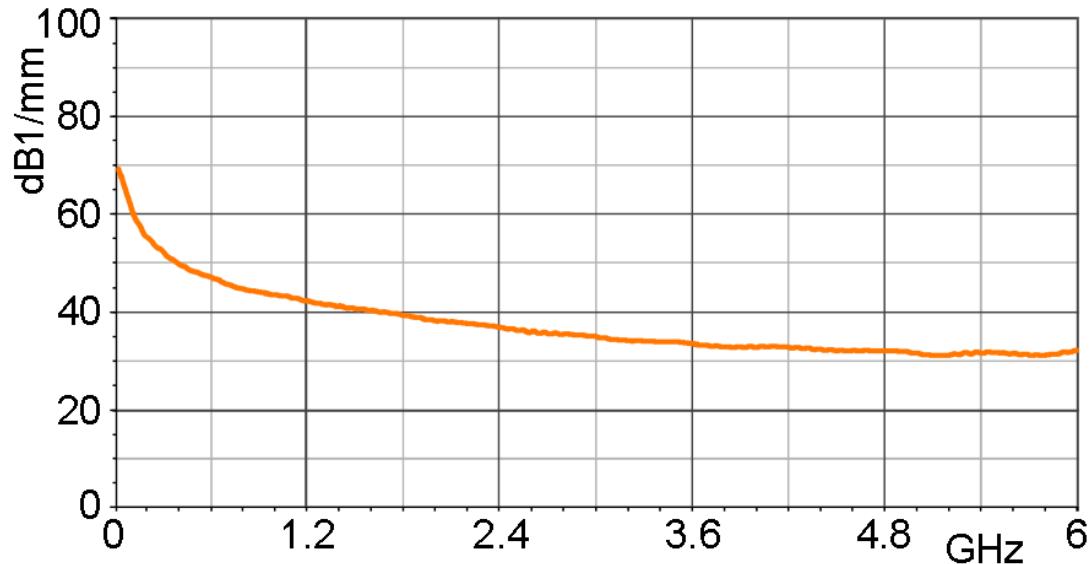
Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 6 GHz
Maße Sondenkopf:	$\approx (5 \times 5) \text{ mm}$
Anschluss - Ausgang	SMA, female, jack

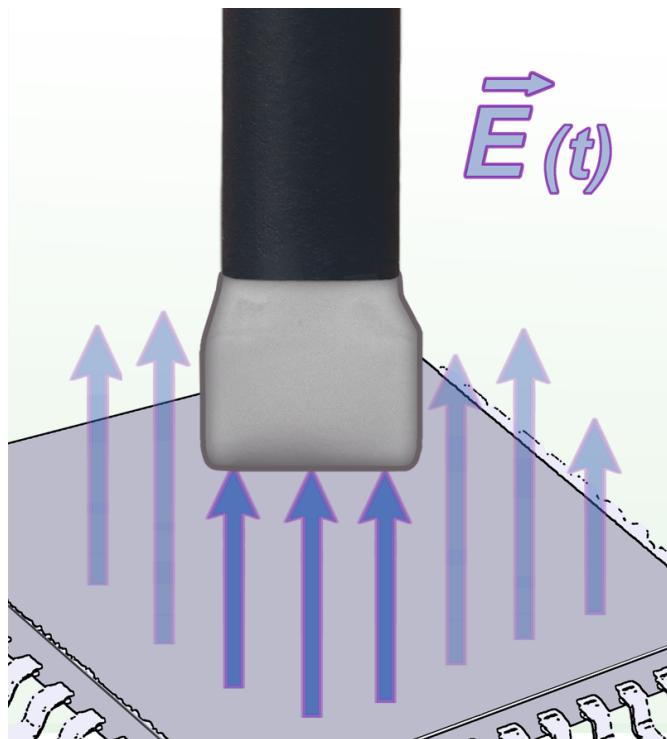
Frequenzgang [$\text{dB}\mu\text{V}$] / [$\text{dB}\mu\text{V/mm}$]



Korrekturkurve E-Feld [dB μ V/mm] / [dB μ V]



Messprinzip



Sondenkopf

